**AKKREDITOINTIPÄÄTÖKSEN MUUTOSHAKEMUS**

Akkreditoidun toimielimen nimi:

Akkreditointitunnus:

Voimassa oleva päätös:

Haemme nykyiseen akkreditointipäätökseemme:

[ ]  pätevyysalueen laajennusta, esitys liite 1

[ ]  pätevyysalueen päivitystä, esitys liite 1

[ ]  pätevyysalueen supistusta, esitys liite 1

[ ]  muu muutos (organisaatio, toimipisteet…). Mikä?

Oheistamme muutosta/laajennusta koskevat oleelliset lisätiedot alla olevan **liiteluettelon** mukaisesti:

1. Pätevyysalueen muutosesitys Liite 1
2. Menetelmäohjeet, validointitiedot ja vertailumittaustulokset
3. Toimintaohjeet.
4. Laadunvarmistusmenettelyihin liittyvät ohjeet ja suunnitelmat sekä ulkoisten vertailumittausten tulosten yhteenveto.
5. Kyseisen toiminnan vastuuhenkilöt, uusien henkilöiden osalta CV:t.
6. Mittausepävarmuuslaskelmat suurekohtaisesti.
7. Laiterekisteri ja tiedot referenssi- ja käyttönormaalien kalibroinneista.
8. Tiedot seurattavasta kenttäkalibroinnista sekä siihen liittyvät menetelmäohjeet.
9. Muu muutoshakemuksen arviointia tukeva aineisto.

Hakemus liitteineen toimitetaan FINASin ekstranettiin. On tärkeää, että ilmoitatte meille sähköpostitse osoitteeseen akkreditointi@finas.fi, kun aineisto on viety Ekstranettiin.

Viestin otsikoksi aihekenttään pyydetään merkitsemään akkreditointitunnus. Kiitos!

Kalibrointilaboratorion edustaja:

pp.kk.vvvv, Etunimi Sukunimi

Akkr.tunnus: K

| PÄTEVYYSALUEEN LAAJENNUKSET, esimerkiksi uudet suureet/menetelmät/kohteet, mittausalueet ja/tai mittauskyvyt (lisätkää rivejä tarvittaessa) Huom. Myös kieliversiot. |
| --- |
| **Suure / menetelmä / kohde***Quantity / method / object* | **Mittausalue***Measurement range* | **Mittauskyky, laajennettu mittausepävarmuus (k=2)***CMC, Expressed as Expanded Uncertainty (k=2)* |
| Esim.Kaarimikrometri*External micrometer* | 0–100 | ±Q[1,8; 13,3L] µm |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |

| MUUTOKSET/PÄIVITYKSET PÄTEVYYSALUEEN MENETELMIIN, esimerkiksi mittausalueen ja/tai mittauskyvyn muutokset (lisätkää rivejä tarvittaessa)Huom. Myös kieliversiot. |
| --- |
| **Suure / menetelmä / kohde***Quantity / method / object* | **Mittausalue***Measurement range* | **Mittauskyky, laajennettu mittausepävarmuus (k=2)***CMC, Expressed as Expanded Uncertainty (k=2)* |
| Esim.Kaarimikrometri*External micrometer* | 0–100 | ±Q[1,8; 13,3L] µmPÄIVITETÄÄN |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |

| PÄTEVYYSALUEEN SUPISTUKSET (lisätkää rivejä tarvittaessa)Huom. Myös kieliversiot. |
| --- |
| **Suure / menetelmä / kohde***Quantity / method / object* | **Mittausalue***Measurement range* | **Mittauskyky, laajennettu mittausepävarmuus (k=2)***CMC, Expressed as Expanded Uncertainty (k=2)* |
| Esim.Kaarimikrometri*External micrometer* | 0–100 | ±Q[1,8; 13,3L] µmPÄIVITETÄÄN |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |        |       |
|       |       |       |